

プレートリーダー基礎講座(全3回) ～見落としがちな「測定のコツ」お教えします～

講演：テカンジャパン株式会社

開催日：2026年 5月12日(火) 13:00～14:30 《第2回》

2026年 6月17日(水) 13:00～14:00 《第3回》

参加申し込み締切日：2026年 6月16日(火) 12:00まで

申込URL：<https://forms.cloud.microsoft/r/asSNVZqZGU>

右のQRコードから申し込みへアクセス



※第1回お申込みいただいた方は、改めてのお申込みは不要です。
第2回、第3回のインビテーションをお送りします。

第2回

実践的な測定のコツと
ラボウェアの選択方法

「設定のミス」なのか
「装置の不調」なのかを
見極めたいかた必見です！

**数値のばらつきや
感度不足の回避方法を伝授。**

その他、光学的影響を
抑えるための
ラボウェア選定法もご紹介

第3回

装置QCおよび
データ品質管理と
トラブルシュート

自らおこなえる装置の
セルフQC手法の伝授。

データの信頼性と再現性を
把握、監視するための
ノウハウを解説します。

気になるデータが
出た際に役立つ
トラブルシュート・フローを
公開し、迷わず対処できる
スキルを身につけます。

第1回
終了

装置の中では何が起きている？
～光学系の解剖学と全測定機能の基礎～

分光器の構造や検出器（PMT等）の特性など、
ハードウェアの基礎を徹底解説。
フィルター式とモノクロメーター式の決定的な違いや、
測定モードごとの原理・注意点を丁寧に紐解きます。

※2.3回目の講演前に1回目のアーカイブ配信をいたします。

第2回

実践的な測定のコツと ラボウェアの選択方法

2026年 5月12日(火) 13:00～14:30

「設定のミス」なのか「装置の不調」なのかを見極めたいかた必見です！

数値のばらつきや感度不足の回避方法を伝授。

その他、光学的影響を抑えるためのラボウェア選定法もご紹介

第3回

装置QCおよびデータ品質管理と トラブルシューティング

2026年 6月17日(水) 13:00～14:00

自らおこなえる装置のセルフQC手法の伝授。

データの信頼性と再現性を把握、監視するためのノウハウを解説します。

気になるデータが出た際に役立つトラブルシューティング・フローを公開し、

迷わず対処できるスキルを身につけます。



 **アルテア技研株式会社**

本社：つくば営業所・三島営業所・東京多摩営業所
千葉出張所・富士サテライトオフィス

◎本社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
TEL：045-473-6211 FAX：045-473-2884

◎東京多摩営業所(多摩イノベーションスタジオ)
〒206-0014 東京都多摩市乞田895
TEL：042-400-7737 FAX：042-400-7738

 **ダイオテック東京株式会社**

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-2-1
Tel 03(3842)4882 / Fax 03(3842)4892
<https://www.diotec.co.jp>

 **株式会社ヨシキ**
Yoshiki Co., Ltd.

◎本社 藤枝営業所
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山1-15-15
TEL：054-644-5225
◎浜松営業所
〒432-8045
静岡県浜松市中央区西浅田2丁目2-18
TEL：053-489-8512